درس مقولات ویژه در فیزیک ماده چگال

میکروسکوپ نیروی اتمی AFM

سید محمد مهدی صدرنژاد

(نیمسال اول سال تحصیلی ۸۹–۱۳۸۸)

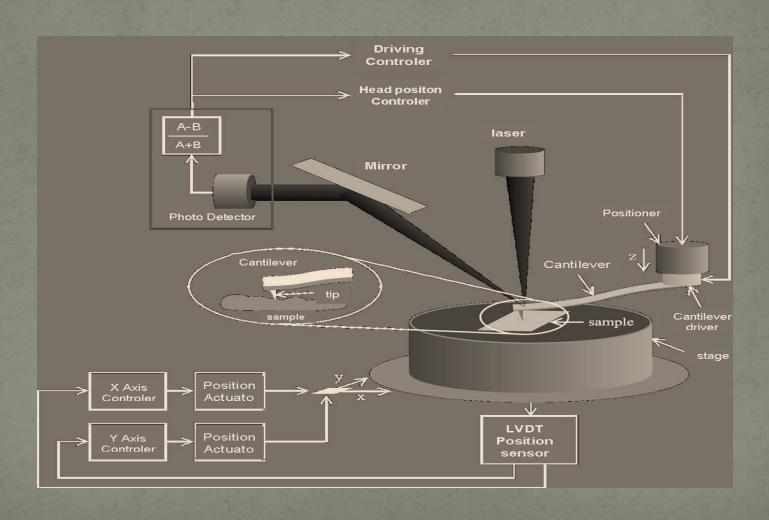
مقدمه

- دستگاهی برای بررسی خواص و ساختار سطحی مواد در ابعاد نانومتر
 - مزایا استفاده از میکروسکوپ نیرو اتمی:
 - امکان عملکرد در محیط های مختلف مانند: خلا، هوا ومایع
- انعطاف پذیری، سیگنالهای بالقوه متعدد و امکان عملکرد دستگاه در مدهای مختلف و عدم وجود محدودیت اساسی در نوع و محیط سطح
 - سطوح: رسانا یا عایق، نرم و سخت، منسجم و پودر، بیولوژیک و آلی یا غیرآلی
 - خواص قابل اندازه گیری:

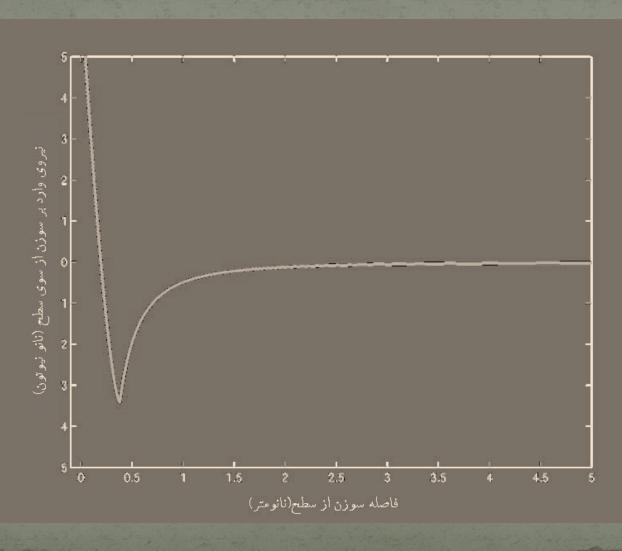
- کشسانی
- مغناطيس
- بزرگی پیوندهای شیمیایی
- توزیه بارهای الکتریکی سطحی
- وطبش الكتريكي نقاط مختلف

- مورفولوژی هندسی
 - توزیع چسبندگی
 - اصطکاک
 - ناخالصي سطحي
- جنس نقاط مختلف

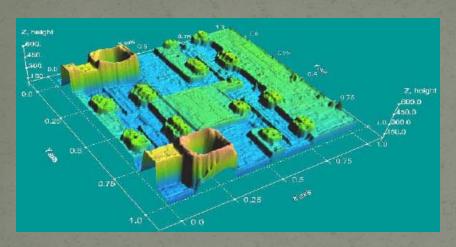
AFM sple opi

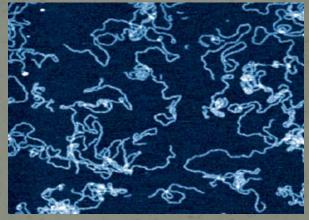


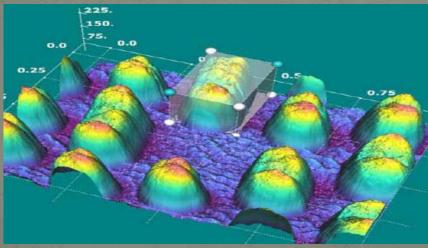
قابعیت نیروی واره بر سوزن از فاصله سوزن با سطح



چند نمونه على AFM

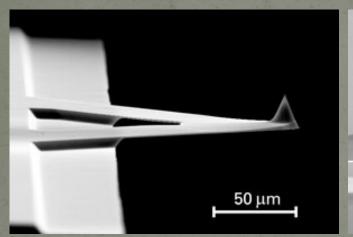


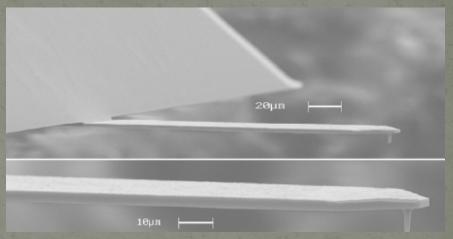


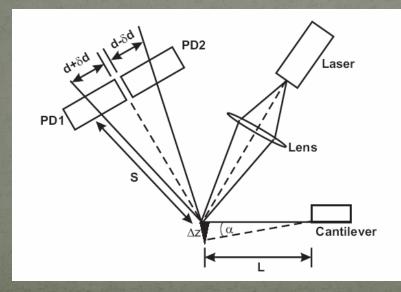


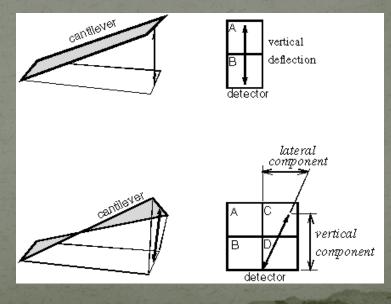


انواع و آشکار سازی چینگیری تیرک

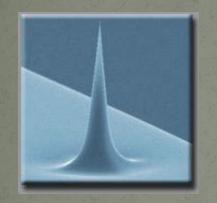




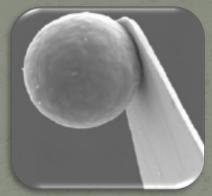




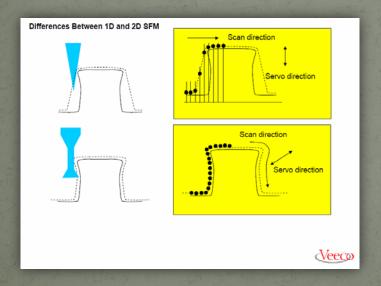
سوز نها و پر همکنشی سوزن با سطح

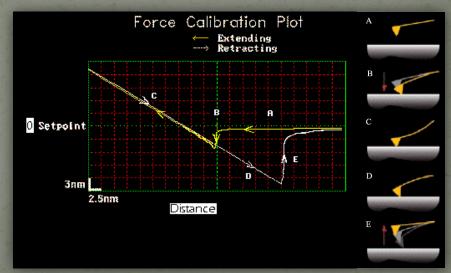


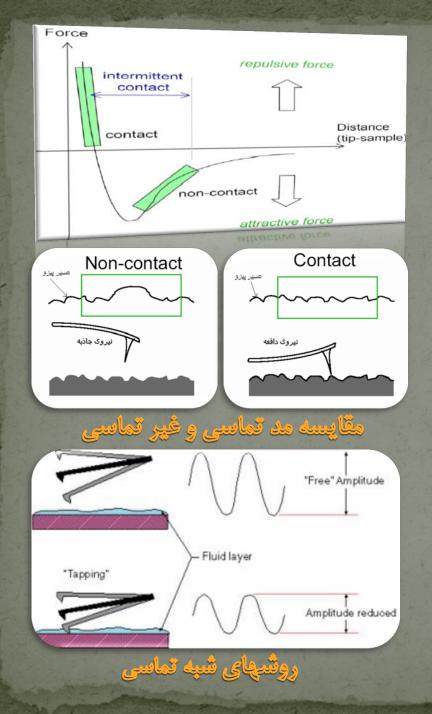






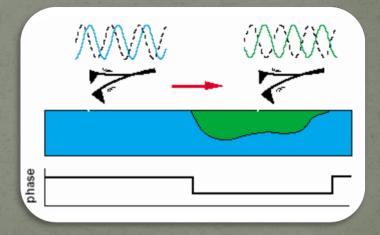






AFM slow

مد نیروی ثابت مد ارتفاع ثابت مد دامنه ثابت



مد تعبوير برداري از اختلاف فاز

SEM	TEM	STM	AFM	نوع دستگاه مورد منایسه
نانومتر	آنگتروم (در نوع تفکیک پذیری بالا HRTEM)	آنگ شروم	آنگستروم (بررسی چیدمان اتمی مطوح بوسیلهٔ سوزنهای فوق تیز و بسیار سخت)	بیشترین دقت
۴۰۰-۲۰۱ دلار (نوع تفکیک پذیری بالا)	بالای ۵۰۰ دلار(نوع تفکیک پذیری بالا)		۱۰۰-۲۰۰ دلار (نوع تفکیک پذیری بالا)	هزينه
- چندین ساعت برای رسیدن به خملاء بـالا مورد نیاز است	- بررسی تموند های توده ای (Bulk) نیاز بمه چندین هفته زمان بسرای نازکاری تموند دارد نیاز به خلاه بسیار بالا، حداقل زمان تهیهٔ تصویر را چندین ساعت می سازد.	- چندین ساعت برای رسیدن به محلاء یالا مورد نیاز است.	- وابسته به مد از چند دقیقه تا چند ساعت - در حالت عادی نمونه آماده سازی نمی خواهد - برای بررسی پردرها و نمونه های بیرلوژیک باید فرآیند تثبیت این مواد به زیر لایه صورت گیرد اندازه گیری در محیط خلا، نیاز به مدت زمان تخلیه محفظه دارد.	سرعت اندازه گیری و آماده سازی نمونه
- مطع مورد بررسی حتماً باید رسانا باشد تهد تصاویر سه بعدی فرآیند سر است و استانداردی نیست و نیاز به کالیبراسیونهای - برای بررسی سطرح عایق باید مسطح با لایهٔ ناز کی از ماده رسانا پوشانده شود که مورفولوژی می شود و تشکیکت تغییسر دورفولوژی می شود و تشکیکت بذیری را به چندین نانومتر کاهش می دهد.	تصاویر را بصورت دو بعدی تهیبه می کند (عمق ندارد)	- سطح مورد بررسی حتماً باید رسانا باشد. - برای بررسی سطح عایق باید سطح با لایه ناز کی از ماده رسانا پوشانده شود که علاوه بر زمانیر بودن باعث تغییر مورفولوژی می شود و تفکیک بذیری را به چندین نانوعتر کاهش می دهد. - وابستگی جریان به عواملی غیر از فاصله سوزن از سطح از جمله چگالی حالات الکترونها، ولتازیایاس، و شدت جریان جمله چگالی حالات الکترونها، ولتازیایاس، و شدت جریان شود .	- محدودیت بنیادینی بر روی نوع ماده یا محیط آن وجود ندارد و بر حسب شرایط از مد مناسب استفاده می شود. - تنها محدودیت ایس روش عدم توانسایی بررسسی ساختار سوراخهایی با عمقی بیش از طول سوزن است (حدود ۱۰ میکرومتر)	محدوديت
ساختار سه بعدی سوراخهای عبیق سطح هم قابل بررسی هستند. -بررسی جنس نقاط مختلف سطح و توزیح خواص سطحی ممکن است.		دفت زیر آنگسروم - حساست زیاد جریان به فاصلهٔ سوزن از سطح [بیشتر از ۹۰٪ جریان الکتریکی گذرنده از سوزن (سیگال) از تک ملکول نوک سوزن و نزدیکترین نقطهٔ سطح می گذرد که باعث ناچیز بودن جریان بقیهٔ نقاط سطح و کم شدن نداخل اطلاعات ناشی از بقیهٔ نقاط می شود. این مساله به افزایش دفت تعیین فاصلهٔ سوزن از سطح می انجامد.]	- امکان عمل دستگاه در مجیشهای هواه خالاه و مایع (در نتیجه امکان بررسی ذرات و موادی که در خالاه تصعید می شوند یا ذرات معلق درمایع) - تصاویر را بصورت سه بعدی تهیه می کند - بررسی جنس نقاط مختلف سطح و توزیح خواس سطحی	توانمنــــدی و مزیت

میایشه با سایخ روشهای برور ساختار سطنی

